



# 検査&ものづくりイノベーション研究会 2023年度公開研究会

## ◆公開研究会のご案内

### いまさら聞けない『実装基板検査の基礎技術とDFT』 ～製造業のDXを加速させる「デジタルツイン」～

近年、産業界の大きなトレンドとして「デジタルトランスフォーメーション（DX）」が注目されています。DXには様々な段階があり、日本の製造業ではDXの最初の段階となるデジタルによる自動化がはじめられています。しかし、DXが真価を発揮するには、そこから一步進む必要があります。デジタル化した生産ライン、検査ラインから得られる膨大なデータを集約・解析させ、さらには仮想工場(デジタルツイン)を駆使し、新たな価値創造へとつなげるからこそ、DXの根幹と言えます。

実装基板の製造現場では、品質を保証しつつ、検査にかかる費用の削減が経営面からも課題になっています。そのため、検査の立ち位置も、最小限の設備で複雑化した基板の不良検出のみにとどまらず、製造プロセスへの改善要求や、基板を含めた部品材料の選定への提案にまで幅を広げる必要が出てきています。

今回の公開研究会では、DXを活用したテスト容易化設計「DFT」と実装準備工程の最適化の紹介、実装基板検査の基礎技術として、構造検査のインサーキットテストの基礎技術とJTAGテスト/バウンダリスキャンの基礎技術と活用事例を解説します。

開催日時 2023年12月1日(金)13:00～16:30

開催方式 対面開催 先着50名

開催会場 シーメンスEDAジャパン(株) 東京本社(品川)

東京都品川区北品川4丁目7番35号 御殿山トラストタワー

[アクセスマップ](#)

13:00 ~

開会の挨拶 幹事

13:05 ~

検査技術委員会の紹介 委員長 内山 浩志(株式会社ニューリー・土山)

13:20 ~

講演1:「実装設計の品質向上と実装準備プロセスの最適化」

～ デザインフローにおけるプロアクティブなDFTの活用 ～(60分)

シーメンスEDAジャパン株式会社 吉田 昌広 氏 (旧メンターグラフィックス)

(休憩10分)

14:30 ~

講演2:「インサーキットテスト、フライングプローブテストの基礎技術」(45分)

日置電機株式会社 阿部 伸之 氏

15:15 ~

講演3:「バウンダリスキャンテストの基礎技術と活用事例」(45分)

アンドールシステムサポート株式会社 谷口 正純 氏

16:00 ~

フリートーク

16:30

閉会の挨拶 幹事

※プログラムは変更になることがありますので、ご了承ください。

検査&ものづくりイノベーション研究会 幹事 阿部 伸之 (日置電機株式会社)

info-kensa@jiep.or.jp

## 参加要項

定 員 50名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)

参加費(消費税込み)

正会員, シニア会員, 賛助会員: 3,000円 ※賛助会員(クーポン利用): 無料

非会員一般: 4,000円

学生, 非会員学生, 名誉会員, ミッションフェロー: 無料

## 注意事項(参加方法)

- ①申込が受理されますと、**返信メールで公開研究会へのご案内やお支払いに関する情報**をご連絡致します。
- ②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。  
(お支払い方法: 銀行振込・クレジットカード決済)
- ③請求書や振込確認後の領収書のご発行は、返信メールのマイページから出力が可能です。
- ④WEBの請求書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
- ⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。
- ⑥参加費決済方法: クレジットカード決済か銀行振込をご選択いただけます。  
銀行振込の場合の振り込み先は、マイページ「決済」タブより出力いただく請求書の下部をご確認ください。

\* キャンセルポリシー

お申込み後のキャンセルはできません。

**下記から参加申し込みをお願いします。**

**会員/賛助/非会員の方**

※クーポン使用の場合は「クーポン利用」をご選択ください。

問い合わせ先 一般社団法人エレクトロニクス実装学会  
E-mail: info¥jiep.or.jp  
(メールアドレスは¥を@に置き換えてください)